

ICS 31.200
L 90



中华人民共和国国家标准

GB/T 16523—1996

圆形石英玻璃光掩模基板规范

Specification for
round quartz photomask substrates

1996-09-09发布

1997-05-01实施

国家技术监督局发布

前　　言

本标准等效采用 SEMI 标准的 SEMI P4—92《圆形石英玻璃光掩模基板规范》。

本标准第 3 章要求全部按 SEMI P4—92 制定, 标准格式按 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则标准编写的基本规定》编制。

SEMI 标准是半导体设备和材料国际标准, 具有较高的科学性和先进性, 内容全面, 标准配套。本标准与已经转化为我国标准的 SEMI P1—92《硬面光掩模基板》(GB/T 15871—1995)、SEMI P2—86《硬面光掩模用铬薄膜》(GB/T 15870—1995)、SEMI P3—90《硬面感光板中光致抗蚀剂和电子束抗蚀剂规范》(GB/T 16527—1996)、SEMI P6—88《光掩模对准标记规范》(GB/T 16524—1996)及准备转化为我国标准的 SEMI P21—92《掩模曝光系统准确度表示准则》、SEMI P22—93《光掩模缺陷分类和尺寸定义的指南》、SEMI P19—92《用于集成电路制造技术的检测图形单元规范》等项标准形成一个微型构图标准系列。

本标准附录 A 是提示的附录。

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由电子工业部标准化研究所归口。

本标准起草单位:长沙韶光微电子总公司,电子工业部标准化研究所。

本标准主要起草人:谈仁良、吴保华、王亦林、韩艳芬。

中华人民共和国国家标准

圆形石英玻璃光掩模基板规范

GB/T 16523—1996

Specification for
round quartz photomask substrates

1 范围

本标准规定了圆形石英玻璃光掩模基板的技术要求、试验方法等内容。

本标准适用于圆形石英玻璃光掩模基板。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 191—90 包装储运图示标志

GB 2828—87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 2829—87 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

GB 7238—87 玻璃及铬版表面平整度的测试方法

GB 9622.2—88 电子玻璃平均线热膨胀系数的测试方法

3 要求和测量方法

3.1 外形尺寸

3.1.1 圆形石英玻璃光掩模基板的外形见图 1 和图 2,外形尺寸见表 1 和表 2。